

# 双晶线性阵列探头

## 快速、简便、可靠的腐蚀成像



用于腐蚀检测的新型双晶线性阵列（DLA）探头，与常规超声双晶探头相比，具有更多优势特性。这种相控阵解决方案，通过诸如更大的声束覆盖范围、更快的扫查速度，及具有更高数据点密度的C扫描成像等特性，提高了检测效率。与标准的相控阵脉冲回波相比，这款新探头所使用的一发一收技术在腐蚀测量应用中可提供更好的近表面分辨率及更好的点蚀探测能力，从而可提高危害性壁厚减薄的探出率。

得益于一些新添性能，例如：内置灌溉，以及可使探头更好地贴附于管材曲面的可更换式曲面延迟块，双晶线性阵列（DLA）腐蚀探头现在可用于完成自动检测。



NEW 可更换式延迟块

### 探头特性

- 近表面1毫米的探测性能。
- 新添可更换式延迟块。
- 新添内置灌溉。
- 新添高温选项。
- 声束覆盖宽度高达30毫米。
- 快速调整系统，可适用于直径从4英寸到平面材料的检测。
- 硬质合金防磨板，可保护楔块。
- 碳钢材料典型的检测深度范围为1毫米到80毫米。
- USB存储盘中的OmniScan配置文件（MX、MX2和SX）。

### OmniScan软件的特性

- 侧视图、端视图和俯视图成像（B扫描、D扫描和C扫描）。
- 完整的高分辨率A扫描存储。
- 两个可配置的探测闸门。
- 在OmniScan仪器或使用OmniPC的计算机中进行离线分析。

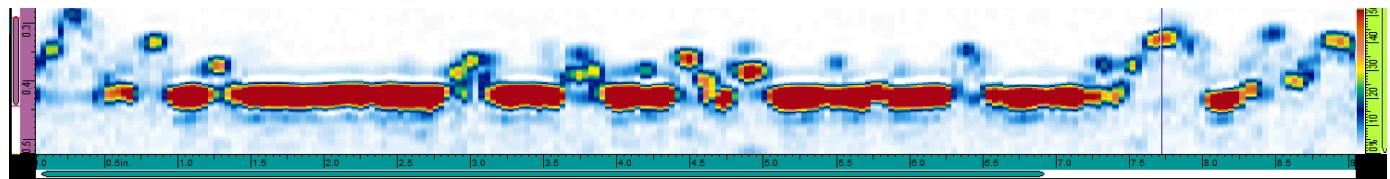
# 新特性，新潜能

与OmniScan SX探伤仪一起使用时，双晶线性阵列（DLA）腐蚀探头可谓是一款价格合理的检测选择。其设置和操作简便易行：加载所提供的设置文件，对仪器进行校准，然后进行检测并记录数据。无需使用脉冲发生/接收（PR）仪器。

无论是在使用编码器对某个区域进行快速手动扫查时，还是在使用MapROVER电动扫查器进行高速全体积成像操作时，双晶线性阵列（DLA）腐蚀探头都是在光滑表面上快速方便地完成C扫描成像的一款首选工具。添加了新型可更换式曲面延迟块和灌溉特性的创新型探头稳定系统，如今可在直径小如4英寸的管材表面上提供优质的声传播效果。此外，用户现在可以订购高温双晶线性阵列（DLA）腐蚀探头，这款探头可以在温度高达150° C的表面上进行检测。



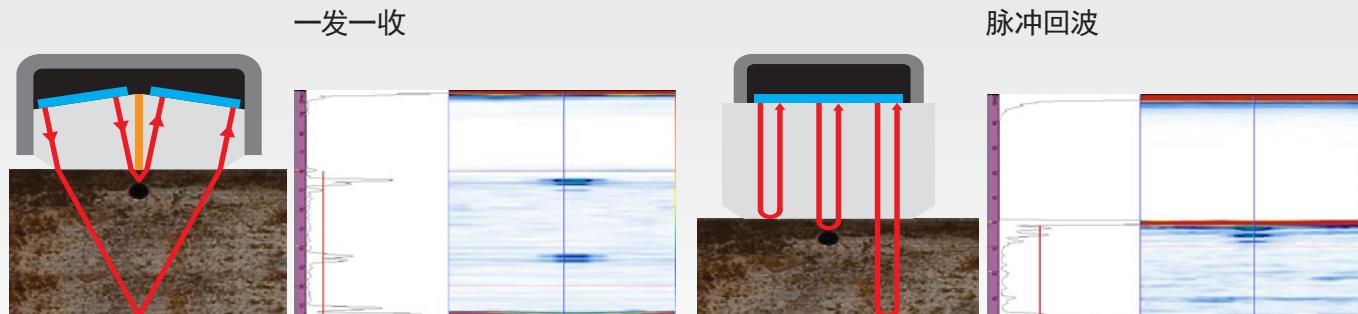
在自动检测中与MapROVER扫查器一起使用的DLA腐蚀探头



碳钢管道上腐蚀缺陷的B扫描图像

## 双晶阵列一发一收技术

与双晶UT探头一样，双晶线性阵列探头包含一组发射晶片和一组接收晶片，这两组晶片被分别安装在切有固定屋顶角的延迟块的两部分上。这种配置可以生成在被测工件表面以下聚焦的声束，从而可极大地降低表面反射的波幅。这种配置还可以提高近表面分辨率，得到对诸如点蚀、蠕变损伤及HIC（氢致裂纹）等危害性缺陷的更高的探出率。



与相控阵脉冲回波相比，一发一收技术仅生成极小的界面回波，可提供更好的近表面分辨率。

## 订购信息

工件编号	订购编号	频率 (MHz)	晶片数量	晶片间距 (毫米)	激活孔径 (毫米)	晶片高度 (毫米)	线缆长度 (米)	应用
7.5DL32-32X5-REX1-P-2.5-OM-IHC-RW	Q3300635	7.5	64 (2 × 32)	1	32	5	2.5	手动
7.5DL32-32X5-ULT1-H150-2.5-OM-IHC-RW	Q3300636	7.5	64 (2 × 32)	1	32	5	2.5	手动高温
7.5DL32-32X5-REX1-P-7.5-OM-IHC-RW	Q3300649	7.5	64 (2 × 32)	1	32	5	7.5	手动和自动

这些探头的标准配置中包含一个OmniScan连接器。